MICROCRE 研润光机

MARSURF-XCR20 表面粗糙度轮廓仪

产品资料摘要

型号 MARSURF-XCR20 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

MARSURF XCR 20 粗糙度和轮廓测量站 在测量站使用 MarSurf XCR 20 测量粗糙度和轮廓 这个综合的测量站可在一台测量站上同时执行表面粗糙度和 轮廓测量。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
接触速度（Z 方向）	0.1 至 1 mm/s
测杆长度	175 mm, 350 mm
测量速度（文本）	0.2 mm/s 至 4 mm/s
针尖半径	25
扫描长度末尾（X 方向）	200 mm

参数项目	原站列示数值或说明

参数项目	原站列示数值或说明
分辨率	Z 方向，相对探针针头： 0.38 µm（350 mm 测杆）/ 0.19 µm（175 mm 测杆） Z 方向，相对测量系统： 0.04 µm
扫描长度开始（X 方向）	0.2 mm
取样角	在平滑表面上，取决于偏差： 后缘高至 88°，前缘高至 77°
定位速度（文本）	X 方向返回速度：0.2 至 8 mm/s Z 方向：0.2 至 10 mm/s
导块偏差	< 1 µm（200 mm 以上）
测量原则	探针法
输入	R 测头，MFW 250 光学测头 Focodyn*、LS 1*、LS 10*（*仅结合 PGK 或 GD 120 CNC 驱动装置）
测量范围 mm	(in Z) 50 mm MFW 250: ±25 µm，±250 µm，（最高 ±750 µm）；±1000 µin，±10,000 µin（最高 ±30,000 µm）
扫描长度（文本）	自动；0.56 mm；1.75 mm；5.6 mm；17.5 mm，56 mm，（.022 / .070 / .224 / .700 / 2.240 英寸），测量至挡块，可变
采样长度数量符合 ISO/JIS	1 至 50（默认：5）
测量力 (N)	1 mN 至 120 mN 左右（可在 MarSurf XC 20 中设置）

本摘要列出前 16 项完整参数；完整技术表、适用条件和配置选项请查阅以下原始产品页面。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/MARSURF-XCR20.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。